

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

10; 12

Журнал технической физики, т. 61, в. 3, 1991

© 1991 г.

ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ В ПРИОСЕВОЙ ОБЛАСТИ КВАДРУПОЛЬНОГО ФИЛЬТРА МАСС

Н. В. Коненков, С. С. Силаев

Знание распределения плотности ионов в приосевой области квадрупольного фильтра масс (КФМ) важно для понимания физики работы прибора [1]. В практических приложениях эти знания полезны при конструировании коллекторного узла масс-спектрометра [2], построении и согласовании фильтров масс тандемного квадрупольного масс-спектрометра [3]. Анализ влияния объемного заряда на режим сепарации также требует предварительной информации о поперечном распределении ионов [1].

Целью данной работы является изучение плотности распределения ионов в поперечной плоскости квадрупольного анализатора, работающего в промежуточной области стабильности [4].

Плотность распределения $n(x, y, \xi)$ ионов в поперечной плоскости x, y КФМ в момент фазы $\xi = \omega t / 2$ ВЧ поля, где $\omega = 2\pi f$ — угловая частота, дается выражением [1]

$$n(x, y, \xi) = \frac{4 [\epsilon_x B_x(\xi) - x^2]^{1/2} [\epsilon_y B_y(\xi) - y^2]^{1/2}}{\pi^2 B_x(\xi) B_y(\xi)}, \quad (1)$$

где $\epsilon_x B_x$ и $\epsilon_y B_y$ — максимальные допустимые значения координат по осям x и y анализатора в момент фазы ξ ; ϵ_x и ϵ_y — акцептансы КФМ по x и y координатам соответственно; B_x и B_y — параметры эллипсов [5], характеризующие захват ионов по поперечным скоростям.

Наблюдение распределения плотности ионов выходного пучка требует усреднения по периодам фазы ξ

$$n(x, y) = \frac{4}{\pi^2} \int_0^\pi \frac{[B_x(\xi)/B_{0x} - x^2]^{1/2} [B_y(\xi)/B_{0y} - y^2]^{1/2}}{B_x(\xi) B_y(\xi)} d\xi, \quad (2)$$

где в качестве единицы длины выбран радиус поля r_0 (радиус вписанной окружности между вершинами электродов), поскольку $\epsilon = r_0^2/B_0$ [6]; B_{0x} и B_{0y} — максимальные значения B -параметров при изменении фазы от 0 до π .

Интеграл (2) рассчитывался методом трапеций в точках

$$(x_i, y_i) = (\pm 0.1i, \pm 0.1j); \quad i, j = 0, \dots, 9. \quad (3)$$

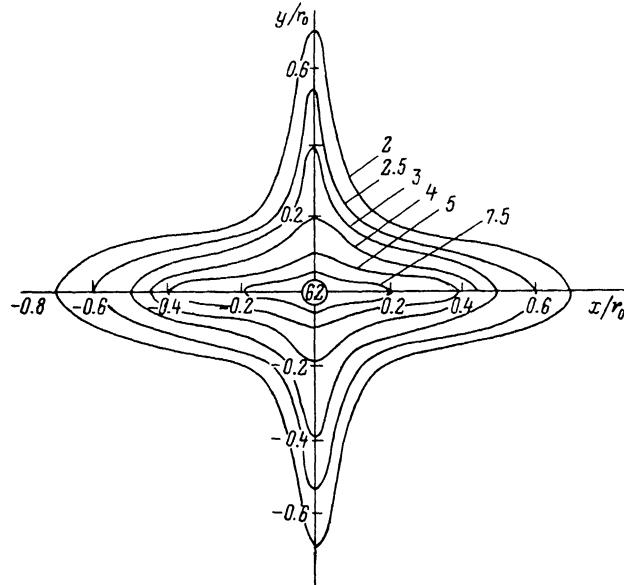
В расчетах B -параметров эллипсов захвата численным методом [5] дискретность времени $\Delta \xi = \pi/1000$ и интервал фазы $\Delta \xi = \pi/20$.

Результаты расчета плотности распределения $n(x, y)$ представлены на рисунке для случая относительной полосы пропускания КФМ $R = q/\Delta q = 200$ в точке $a = 3.15879$, $q = 3.23408$ ($\beta_x = 1.9510$, $\beta_y = 0.2443$) промежуточной области стабильности. На рисунке приведены изолинии плотности ионов, отмеченные цифрами, умноженные на 10^4 . Данные рисунка получены в предположении бесконечно большого времени сортировки, отсутствия влияния краевых полей, взаимодействия ионов друг с другом.

В [3] при использовании микроканальной пластины и флуоресцирующего экрата было получено, что распределение ионов по сечению выходного пучка имеет чечевичнообразную форму, вытянутую вдоль y -электродов, на которые подают отрицательный потенциал при анализе положительных ионов. Эти данные согласуются с результатами [1].

Как следует из рисунка, плотность распределения $\bar{n}(x, y)$ в режиме сепарации промежуточной области существенно отличается от наблюдаемой в обычном режиме [1, 3]. В соответствии с (1) распределение симметрично относительно осей x , y . Преимущественная локализация ионов в КФМ происходит как по оси x , так и по оси y , что довольно неожиданно, поскольку параметры B_x и B_y сильно отличаются [4].

Для КФМ в промежуточной области стабильности характерно более слабое падение пропускания T от разрешающей способности R (ориентировочно $T \sim R^{-1}$ [4]) по сравнению с обычно используемой первой областью, когда $T \sim R^{-2}$ [6]. Возможно, до некоторой степени это явление отражено на рисунке, когда пространственный объем стабильных траекторий



Структура плотности распределения ионов в поперечной плоскости КФМ, работающего в промежуточной области стабильности в рабочей точке $a=3.15879$, $q=3.23408$ ($\bar{n}(0, 0)=6.2 \cdot 10^{-3}$).

вблизи оси анализатора значительно больше для рассматриваемого случая, чем для обычного КФМ.

Полученное распределение ионов в КФМ в промежуточной области соответствует до некоторой степени распределению ионов КФМ в первой области, работающему в ВЧ режиме [1, 3]. Это соответствие дает надежду на хорошее согласование фильтров масс тандемного масс-спектрометра, когда анализаторы работают в промежуточной области стабильности, а КФМ, расположенный в камере столкновений, в ВЧ режиме первой области.

Расчет $\bar{n}(x, y)$ при различных значениях R показал, что величина $\bar{n}(0, 0)$ убывает с ростом R , структура распределения $\bar{n}(x, y)$ (см. рисунок) сохраняется, при этом изолинии n более вытянуты вдоль y -координаты.

Список литературы

- [1] Todd F. J., Waldren R. M., Freer D. A., Turner R. B. // Int. J. Mass. Spectrom. Ion Phys. 1980. Vol. 35. P. 107–150.
- [2] Волков С. С., Коненков Н. В., Могильченко Г. А. и др. // ПТЭ. 1989. № 6. С. 140–142.
- [3] Brier M. E., Amy J. W., Cooks R. G. и др. // Int. J. Mass. Spectrom. Ion Process. 1987. Vol. 77. P. 31–47.
- [4] Шагимуратов Г. И., Коненков Н. В., Могильченко Г. А., Силаков С. С. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 1. С. 117–122.
- [5] Dawson P. H. Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications. Amsterdam: Elsevier, 1978.
- [6] Brunelle C. // Int. J. Mass. Spectrom. Ion Process. 1987. Vol. 76. P. 125–237.